



表面化学分析－用語－
第 1 部：一般用語及び分光法に関する用語

JIS K 0147-1 : 2017
(ISO 18115-1 : 2013)
(JSCA/JSA)

平成 29 年 8 月 21 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準第一部会 基盤技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	奈良 広 一	独立行政法人製品評価技術基盤機構
(委員)	伊 藤 納 奈	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	江 前 敏 晴	筑波大学
	大久保 友 恵	レンゴー株式会社
	大 谷 聖 子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル タント・相談員協会
	大 谷 吉 生	金沢大学
	大 平 由紀子	日本製紙株式会社
	柿 本 章 子	主婦連合会
	金 田 徹	関東学院大学
	重 松 康 夫	一般財団法人日本規格協会
	鈴 木 知 道	東京理科大学
	高 津 章 子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	田 原 江利子	王子ホールディングス株式会社
	中 本 文 男	Na 計測合同会社
	淵 田 隆 義	女子美術大学
	古 谷 涼 秋	東京電機大学

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 29.8.21

官 報 公 示：平成 29.8.21

原 案 作 成 者：表面化学分析技術国際標準化委員会

(〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 国立研究開発法人物質・材料研究機構内 TEL 029-859-2740)
一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 03-4231-8530)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準第一部会 (部会長 酒井 信介)

審議専門委員会：基盤技術専門委員会 (委員長 奈良 広一)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
0 適用範囲	1
1 略語	1
2 形式	3
2.1 定義の中で太字で示している用語	3
2.2 推奨用語	3
2.3 対象分野	3
3 表面化学分析の分析方法に関する用語	4
4 表面分析法に関する一般用語	8
5 多変量解析に関する用語	71
6 表面分析法のための補助用語	79
7 表面分析に関する補助用語	83
8 多変量解析に関する補助用語	89
附属書 A (参考) IEC 60050-111, 国際電気技術用語集一第 111 部: 物理及び化学からの抽出語	90
解 説	92
索 引	96

まえがき

この規格は、工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき、表面化学分析技術国際標準化委員会（JSCA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

これによって、**JIS K 0147:2004** は廃止され、その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

JIS K 0147 の規格群には、次に示す部編成がある。

JIS K 0147-1 第 1 部：一般用語及び分光法に関する用語

JIS K 0147-2 第 2 部：走査型プローブ顕微鏡に関する用語

表面化学分析—用語—

第 1 部：一般用語及び分光法に関する用語

Surface chemical analysis—Vocabulary—

Part 1: General terms and terms used in spectroscopy

序文

この規格は、2013 年に第 2 版として発行された ISO 18115-1 を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお、この規格で点線の下線を施してある参考事項は、対応国際規格にはない事項である。

0 適用範囲

この規格は、表面化学分析に用いる一般用語及び分光法に関する主な用語について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 18115-1:2013, Surface chemical analysis—Vocabulary—Part 1: General terms and terms used in spectroscopy (IDT)

なお、対応の程度を表す記号“IDT”は、ISO/IEC Guide 21-1 に基づき、“一致している”ことを示す。

1 略語

この規格で用いる主な略語は、次による。

AES：オージェ電子分光法 (Auger electron spectroscopy)

AMRSF：平均マトリックス相対感度係数 (average matrix relative sensitivity factor)

ANN：人工ニューラルネットワーク (artificial neural network)

APECS：オージェ電子—光電子コインシデンス分光法 (Auger photoelectron coincidence spectroscopy)

ARAES：角度分解オージェ電子分光法 (angle-resolved Auger electron spectroscopy)

AREPES：角度分解弾性散乱電子分光法 (angle-resolved elastic peak electron spectroscopy)

ARXPS：角度分解 X 線光電子分光法 (angle-resolved X-ray photoelectron spectroscopy)

CDP：深さ方向組成分布 (compositional depth profile)

CRM：認証標準物質 (certified reference material)

DA/DFA：判別分析又は判別関数分析 (discriminant analysis/discriminant function analysis)

DAPCI：大気圧化学イオン化脱離 (desorption atmospheric pressure chemical ionization)

DAPPI：大気圧光イオン化脱離 (desorption atmospheric pressure photoionization)

DART：リアルタイム直接分析 (direct analysis in real time)

dc：直流又は直流電流 (direct current)